
**Analyse chimique des surfaces —
Spectrométrie de masse des ions
secondaires — Dosage des atomes de
bore dans le silicium à l'aide de
matériaux dopés uniformément**

*Surface chemical analysis — Secondary-ion mass spectrometry —
Determination of boron atomic concentration in silicon using uniformly
doped materials*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn